## ВОПРОСЫ БИЛЕТОВ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КУРСУ «ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ» («ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»)

для групп 4731601/80001, 3431601/80001, 3431601/80002, 3431104/80001, 3431104/80002, 3431104/80003 2019/2020 уч. год

- 1. Энергетические уровни атомов и энергетические зоны кристаллов. Объединение атомов в кристалл. Формирование энергетической диаграммы металла на примере лития.
- 2. Энергетические уровни атомов и энергетические зоны кристаллов. Объединение атомов в кристалл. Формирование энергетической диаграммы диэлектрика на примере LiF.
- 3. Четырехвалентный собственный полупроводник. Механизм электропроводности в рамках модели парных ковалентных связей. Переход к модели энергетических зон.
- 4. Четырехвалентный полупроводник *п*-типа. Механизм электропроводности в рамках модели парных ковалентных связей. Переход к модели энергетических зон.
- 5. Четырехвалентный полупроводник *p*-типа. Механизм электропроводности в рамках модели парных ковалентных связей. Переход к модели энергетических зон.
- 6. Принцип формирования одномерных энергетических диаграмм. Классификация энергетических зон. Энергетические диаграммы металла, диэлектрика и собственного полупроводника. Уровень Ферми, работа выхода электрона. Физический смысл уровня Ферми в металле.
- 7. Основные сведения о статистике электронов и дырок в полупроводниках. Функция Ферми и ее физический смысл. Распределение электронов по энергиям в металле и в собственном полупроводнике.
- 8. Равновесная концентрация подвижных носителей в собственных и примесных невырожденных полупроводниках, её зависимость от температуры и ширины запрещенной зоны.
- 9. Положение уровня Ферми в идеальном собственном полупроводнике (вывод на основе принципа нейтральности).
- 10. Идеальный собственный полупроводник: электропроводность при абсолютном нуле и ее изменение с ростом температуры. Подвижные носители заряда; энергетическая диаграмма, положение уровня Ферми при различных температурах.
- 11. Полупроводник *п*-типа: определение, носители заряда (подвижные и неподвижные, основные и неосновные), условие нейтральности, энергетическая диаграмма, положение уровня Ферми при абсолютном нуле; изменение его положения и заселенности примесного уровня с температурой.
- 12. Полупроводник *р*-типа: определение, носители заряда (подвижные и неподвижные, основные и неосновные), условие нейтральности, энергетическая диаграмма, положение уровня Ферми при абсолютном нуле; изменение его положения и заселенности примесного уровня с температурой.
- 13. Тепловая генерация подвижных носителей заряда. Зависимость концентрации электронов проводимости в полупроводнике n-типа от температуры; физический смысл углов наклона участков кривой  $lg \ n = f(\frac{l}{T})$ .
- 14. Зонная диаграмма полупроводника при наличии сильного электрического поля. Ударная генерация подвижных носителей заряда.
- 15. Зонная диаграмма полупроводника при наличии сильного электрического поля. Полевая генерация подвижных носителей заряда.
- 16. Световая генерация подвижных носителей заряда. Фоторезистор, принцип действия, характеристики, параметры.
- 17. Межзонная рекомбинация: разновидности, условия и физический механизм; степень вероятности процесса.
- 18. Рекомбинация через ловушки; её механизм в примесных полупроводниках. Отображение на энергетических диаграммах. Поверхностная рекомбинация.
- 19. Диффузия и дрейф подвижных носителей заряда, диффузионные и дрейфовые токи электронов и дырок. Понятие диффузионной длины. Подвижность.
- 20. Взаимосвязь диффузии и дрейфа подвижных носителей заряда. Полупроводник с неравномерной по объёму концентрацией примеси: процесс установления равновесия и энергетическая диаграмма; основная область применения.
- 21. Процесс установления равновесия на контакте полупроводников *p* и *n*-типа: Токи и их природа, причина возникновения потенциального барьера и контактного электрического поля. Энергетическая диаграмма равновесного перехода.
- 22. Параметры p-n перехода в равновесном состоянии: потенциальный барьер  $e\phi_{\kappa}$ , отображение на энергетической диаграмме: физические причины его возникновения; вывод формулы, порядок величины  $e\phi_{\kappa}$ .
- 23. Параметры p-n перехода в равновесном состоянии: контактное электрическое поле  $\varepsilon_{\kappa}$ ; физические причины его возникновения, вывод формулы, порядок величины  $\varepsilon_{\kappa}$ , распределение поля в пределах перехода.
- 24. Параметры p-n перехода в равновесном состоянии: ширина перехода l; вывод формулы, порядок величины l.  $l_p$ ;  $l_n$  для «односторонних» переходов. Зависимость ширины перехода от концентрации примесей.
- 25. Прямое смещение *p*–*n* перехода; полярность подключения внешнего напряжения, энергетическая диаграмма. Инжекция: определение, условия возникновения. Физическая природа прямого тока. Изменения потенциального барьера и ширины перехода.
- 26. Обратное смещение *p-n* перехода; полярность подключения внешнего напряжения, энергетическая диаграмма. Экстракция: определение, условия возникновения. Физическая природа обратного тока. Изменения потенциального барьера и ширины перехода.

- 27. Характер распределения концентраций неосновных носителей заряда при прямом и обратном смещении p–n перехода; физические причины.
- 28. Вольтамперная характеристика идеализированного *p*–*n* перехода: основные допущения, вывод формулы, график.
- 29. Зависимость вольтамперной характеристики идеализированного *p*–*n* перехода от температуры и материала, из которого он изготовлен и обусловливающие ее физические причины.
- 30. Факторы, отличающие реальный p-n переход от идеализированного. Токи при обратном включении реального перехода.
- 31. Факторы, отличающие реальный *p—n* переход от идеализированного. Токи при прямом включении реального перехода.
- 32. Лавинный пробой *p*–*n* перехода: физическая картина, требования к полупроводниковому материалу, вольтамперная характеристика, зависимость напряжения пробоя от температуры, физическая причина этой зависимости.
- 33. Туннельный пробой p-n перехода: физическая картина, требования к материалу перехода, вольтамперная характеристика, зависимость напряжения пробоя от температуры, физическая причина этой зависимости.
- 34. Стабилитроны: разновидности, простейшая схема стабилизатора напряжения, роль балластного резистора. Физический принцип компенсации температурной зависимости рабочего напряжения стабилитрона.
- 35. Емкость *p*–*n* перехода, ее особенности и разновидности. Барьерная емкость, ее физическая природа и зависимость от напряжения на переходе.
- 36. Емкость *p*–*n* перехода, ее особенности и разновидности. Диффузионная емкость и ее физическая природа. Зависимость диффузионной емкости от напряжения на переходе.
- 37. Переходные процессы в диоде; физические причины их существования. Установление прямого напряжения на диоде при низком и высоком уровнях инжекции.
- 38. Переходные процессы в диоде, физические причины их существования. Восстановление обратного сопротивления диода (тока через диод и напряжения на нём). Время восстановления, заряд переключения. Физические причины инерционности.
- 39. Факторы, влияющие на образование выпрямляющего и омического контактов металл-полупроводник. Омический контакт металл-полупроводник, его разновидности. Энергетические диаграммы.
- 40. Выпрямляющий контакт (барьер Шоттки) металл-кремний n-типа. Условия его формирования, установление равновесия, энергетическая диаграмма, его отличие от p-n перехода. Механизм влияния поверхностного заряда на свойства контакта.
- 41. Прямое и обратное смещение барьера Шоттки, энергетические диаграммы. Токи и их природа. Причина малой инерционности диодов Шоттки.
- 42. Сравнение вольтамперных характеристик кремниевого p-n перехода и барьера Шоттки (металл n-Si) с одинаковыми параметрами. Физические причины их различия. Преимущества диодов Шоттки перед диодами на p-n переходах.
- 43. Биполярный транзистор (БТ): определение, структура, режимы работы, схемы включения  $n^+$ -p-n БТ в активном режиме.
- 44. Физические процессы в БТ при переносе эмиттерного тока в коллектор через базу в активном режиме. Энергетическая диаграмма. Дрейфовый БТ, его особенности и преимущества.
- 45. Токи в БТ, включенном в схему с общей базой и общим эмиттером. Коэффициенты передачи тока, их взаимосвязь и порядок величины.
- 46. Распределения концентраций неосновных носителей в базе в различных режимах работы БТ и физические процессы, определяющие их характер.
- 47. Модуляция ширины базы БТ. Обратная связь по напряжению. Примеры влияния этого фактора на вольтам-перные характеристики БТ. Эффект Кирка.
- 48. Входные вольтамперные характеристики БТ в схеме с общей базой; влияние на них выходного напряжения  $U_{\rm KB}$  и его физическая причина.
- 49. Семейство выходных вольтамперных характеристик БТ в схеме с общей базой; участки, соответствующие различным режимам работы и их физическая интерпретация.
- 50. Входные вольтамперные характеристики БТ в схеме с общим эмиттером, влияние на них выходного напряжения  $U_{\rm K\! >\! }$  и его физическая причина.
- 51. Выходные вольтамперные характеристики БТ в схеме с общим эмиттером. Анализ их формы и причин отличия от выходных ВАХ в схеме с общей базой.
- 52. Влияние температуры на величину тока коллектора БТ в схемах с общей базой и общим эмиттером и на положение выходных вольтамперных характеристик.
- 53. БТ как линейный четырехполюсник. Вывод *h*-параметров, названия и обоснование различия их величин в схемах ОБ и ОЭ.
- 54. Усилительные свойства БТ в схеме с общим эмиттером. Простейший усилительный каскад и его свойства.
- 55. Эмиттерный повторитель схема с общим коллектором. Простейший усилительный каскад и его свойства.
- 56. Схема ключа с использованием БТ. Статические выходные характеристики и нагрузочная прямая. Условия, при которых БТ работает как ключ, его различные состояния (режимы) и физические причины инерционности.
- 57. Условия, при которых БТ работает как ключ. Временные диаграммы входного и выходного токов; распределение концентраций неосновных носителей в базе на разных этапах.

- 58. Импульсные временные параметры БТ. Анализ причин инерционности БТ в схеме ключа. Пути улучшения импульсных свойств. БТ с диодом Шоттки: физические причины его меньшей инерционности.
- 59. Полевой транзистор (ПТ) с управляющим переходом: определение, разновидности, устройство. Механизм влияния напряжения на затворе ( $U_{\rm зu}$ ) на ток стока при постоянном напряжении  $U_{\rm cu}$ . Анализ формы BAX прямой передачи.
- 60. Принцип действия ПТ с управляющим p—n переходом; механизм влияния напряжения сток-исток на ток стока при постоянном напряжении  $U_{3H}$ . Анализ формы выходной ВАХ.
- 61. Параметры малого сигнала для полевых транзисторов (g-параметры). ПТ как усилитель малого переменного сигнала.
- 62. Полевой транзистор с изолированным затвором (ПТИЗ). Определение, разновидности, устройство. Механизм образования индуцированного канала в ПТИЗ.
- 63. Эффект поля в полупроводнике: режимы обеднения, инверсии и обогащения. Пороговый потенциал. Физический принцип формирования индуцированного канала в ПТИЗ.
- 64. Статические ВАХ прямой передачи ПТИЗ с индуцированным каналом; физические процессы, обусловливающие их форму. Влияние температуры на ВАХ. Термостабильная точка.
- 65. Статические выходные ВАХ ПТИЗ с индуцированным каналом; физические процессы, обусловливающие их форму.
- 66. Устройство, принцип действия и области применения мощного ПТИЗ с индуцированным каналом.
- 67. ПТИЗ со встроенным каналом: устройство, два типа канала, полярность напряжений на затворе, стоке относительно истока. Режимы обеднения и обогащения в канале. ВАХ прямой передачи, анализ её формы.
- 68. ПТИЗ со встроенным каналом: Семейство статических выходных ВАХ, физические причины, обусловливающие их форму и зависимость от напряжения затвор-исток.
- 69. Вырожденные полупроводники. P-n переход на их основе, энергетическая диаграмма, отличия от «обычных» p-n переходов.
- 70. Туннельный диод. Требования к материалу *p-n* перехода, принцип действия, вольтамперная характеристика и анализ ее формы с использованием энергетических диаграмм.
- 71. Обращенный диод. Требования к материалу *p-n* перехода, принцип действия, вольтамперная характеристика и анализ ее формы с использованием энергетических диаграмм.
- 72. Динистор: структура, принцип действия, энергетическая диаграмма, два физических механизма его отпирания. Вольтамперная характеристика.
- 73. Тринистор: разновидности, подключение к источникам напряжений, физический механизм управления; вольтамперные характеристики. Параметры тиристоров (с указанием их на вольтамперной характеристике). Симметричный тиристор (симистор).
- 74. *Р*–*п* переход, облучаемый светом: физический механизм возникновения фотоЭДС. Энергетическая диаграмма перехода, облучаемого светом в режиме холостого хода.
- 75. *Р*–*п* переход, облучаемый светом: вольтамперные характеристики, физические причины их сдвига под действием света. Режим фотоэлемента, солнечные батареи.
- 76. Фотодиод: устройство, принцип действия, вольтамперные характеристики, физические причины их сдвига при увеличении светового потока. Параметр, характеризующий чувствительность.
- 77. Светодиод: физические явления, лежащие в основе его работы и принцип действия. Требования к материалу, из которого изготовлен светодиод.
- 78. Светодиод: обоснование выбора полярности подключения; механизм излучения света. Характеристики светодиодов. Оптроны.
- 79. Биполярный транзистор с изолированным затвором. Устройство, принцип действия, основные преимущества и недостатки прибора.
- Гетеропереходы. Требования к полупроводниковым материалам. Выпрямляющий анизотипный гетеропереход: равновесная энергетическая диаграмма и ее особенности. Потенциальные барьеры для диффузии основных носителей заряда.
- 81. Прямое и обратное смещение выпрямляющего анизотипного гетероперехода, физическая природа прямого и обратного токов, вольтамперная характеристика.
- 82. Выпрямляющий изотипный  $n^+-n$  гетеропереход. Требования к полупроводниковым материалам. Равновесная энергетическая диаграмма и ее особенности. Токи при прямом и обратном смещении, причина меньшей инерционности по сравнению с анизотипным переходом.